PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-090511

(43) Date of publication of application: 24.03.1992

(51)Int.CI.

G02F 1/1337

(21)Application number: 02-205848

G02F 1/1333

(22)Date of filing:

01.08.1990

(71)Applicant: KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

(72)Inventor: MURATA MAKOTO

KAMIKITA MASAKAZU

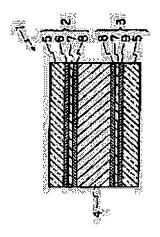
OWADA YOSHIHISA

(54) LIQUID CRYSTAL ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide liquid crystal orientability which is uniform and is substantially free from defects by forming underlying thin films on the surface side to be formed with the oriented films of transparent electrodes.

CONSTITUTION: The liquid crystal element consisting of one electrode body 2 consisting of a glass substrate 5, the transparent electrode 6 formed on this glass substrate 5 and an LB film formed on the surface of this transparent electrode 6, another electrode body 9 consisting of a glass substrate 5, the transparent electrode 9 formed on this glass substrate 5 and an LB film formed on the surface of the transparent electrode 9 and a liquid crystal 4 disposed between these electrode bodies 2 and 3 is formed with the underlying thin films 7 on the surface sides of the transparent electrodes 6, 9 where the oriented films 9 are formed. The underlying thin films 7 have hydrophilic groups of ≥ 500Å and ≤10μm thickness on the surfaces and further, have heat resistance of ≥3 hours at 150° C. The underlying thin films 7 are preferably formed by using a high-polymer material having the hydrophilic groups on the surface, for example, the material expressed by formula. In the formula, R6, R8 are respectively quadrivalent and bivalent groups having at least 2 pieces of carbon atoms.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-90511

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成4年(1992)3月24日

G 02 F

1/1337 1/1333 5 2 0 5 0 5

8806-2K 8806-2K

審査請求 未請求 請求項の数 11 (全10頁)

69発明の名称 液晶素子

> ②特 願 平2-205848

四出 願 平2(1990)8月1日

田 @発 明者 村

誠 兵庫県神戸市須磨区南落合2丁目2番地 落合第2住宅

503 - 808

個発 明 者 上 北 正 和 兵庫県神戸市灘区高羽町5丁目5-21-401

@発 明 太和田 善久 者

兵庫県神戸市北区大池見山台14-39

頣 鐘淵化学工業株式会社 他出 人

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

倒代 理 人 弁理士 朝日奈 宗太 外2名

紀田

1発明の名称

2 特許請求の範囲

液晶杂子

ガラス基板、該ガラス基板上に形成された 透明電極および該透明電極の表面上に形成さ れたLB膜とからなる一方の電極体と、

ガラス基板、抜ガラス基板上に形成された透 明電極および該選明電極の表面上に形成され たLB膜とからなる他方の電極体と、

前記両電極体間に配設されている液晶 とからなる液晶素子であって、

前記透明電極の配向膜が形成される面側に下 地層薄膜が形成されていることを特徴とする 液晶素子。.

前記下地層薄膜が厚さ500 太以上10㎞以下 の親水性器を表面にもち、さらに150℃で3 時間以上の耐熱性を有することを特徴とする 請求項1記載の液晶素子。

- 前記下地層薄膜が、籾水性基を表面にもっ 高分子物質を用いて形成されてなる請求項1 記載の液晶素子。
- 前記下地層薄膜が一般式(面):

$$\begin{array}{c|c}
 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & N - R^4 \\
0 & 0 & 0
\end{array}$$
(BD)

(式中、R'は少なくとも2個の炭素原子を有 する4 価の益、R[®]は少なくとも2個の炭素原 子を有する2個の基)

で表わされる高分子物質からなる請求項1記 戦の液晶素子。

LB膜が熱処理により前記下地層薄膜として 用いた高分子物質と同一の構造をもつ高分子 物質に変換しうる両親媒性高分子物質の単分 子膜を、前記下地層薄膜の上に積層してなる 請求項1記載の液晶素子。

- 6 前記下地層薄膜がSiO₂からなる請求項1記 載の波晶素子。
- 7 前記下地層薄膜がSinN4 からなる請求項 1 記載の液晶素子。
- 8 前記下地層薄膜が金属酸化物からなる請求 項1記載の液晶素子。
- 9 前記金属酸化物がAl 20 3 である請求項8記 載の液晶素子。
- 10 前記金属酸化物がTa₂O₅ である請求項8記載の液晶素子。
- 11 前記金属酸化物がT!O2である請求項8記載の液晶素子。

3発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は透明電極とLB膜との間に下地層薄膜を有する液晶素子に関する。

[従来の技術]

近年、時計やテレビなどの表示媒体として液晶素子を使った平面ディスプレイが広く使用さ

ればならないため、量産性に乏しいという欠点 を有している。

.また、ラピング法は、ラピング時に発生する ゴミや静電気により生産性の低下や品質の劣化 がおこるという欠点を有している。

本出願人はかかる従来技術の問題点に鑑み、 配向膜をLB膜で構成した液晶素子を既に提案している(特願平1-189137号)。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、LB胰は製膜に時間がかかるうえに、その膜厚も薄い。そのため、アモルファスシリコンTFT(薄膜トランジスタ)が形成改造れた基板のように電極部が数千人〜数㎞の段を存する部分に適用すると絶縁不良を生じるおそれがある。これを避けるためには多数回額層、これを避けるためには多数回額層、工程的にもコスト的にも好ましくない。

本発明はかかる従来技術の問題点に選みなされたものであって、数層程度のLB膜であっても、均一でしかも欠陥のほとんどない液晶配向性を

れるようになってきている。

第2図はかかる従来例の液晶素子(IO)の機略断面図である。

この液晶素子(O)は、第2図に示すように電極体(I)、(I)と電極体(I)、(I)の間に充填された液晶(O)とからなっている。

電極体(11)は、ガラス基板(2)とガラス基板(2)上で に形成された透明電板(4)とからなっている。

このガラス基板(3) および(または)透明電極(4) の表面には、液晶の分子配列を均一にするために、物理的もしくは物理化学的方法により表面処理がなされた配向膜(5) が形成されている。

物理的方法としてはS102やAuなどの斜方蒸着法やラビング法、物理化学的方法としてはポリイミド樹脂の塗布ののちラビング処理する方法などがあげられる。

しかしながら、斜方蒸溜法は、液晶に所定のプレチルト角を与えるのに大変有利であるが、 反面真空蒸着であるため、10⁻⁵ torr程度の高真空が必要であり、かつガラス基板を傾斜しなけ

示す液晶素子を提供することを目的とする。

また、本発明はアモルファスシリコンTFT(薄膜トランジスタ)が形成された基板のように電極部が数千人~数㎞の段差を有していても、この段差部分での配向不良のない液晶素子を提供することも目的とする。

さらに、本発明は、強電界性液晶案子のように 2 m程度のガラス基板間隔が必要とされるばあいであっても、絶縁不良のない液晶素子を提供することをも目的とする。

. [課題を解決するための手段]

 特徴としている。

[作用および実施例]

以下、本発明を図面に基づいて説明する。

第 1 図は、本発明の液晶素子の一実施例の概略断面図である。

第1図において、(1)は液晶素子、(2)は一方の電極体、(3)は他方の電極体、(4)は液晶である。

電極体(2) は、ガラス基板(5) とガラス基板上に 形成された透明電極(6) と、この透明電極(6) 上に 形成された下地層薄膜(7) と、この下地層薄膜(7) の上に形成された配向膜(8) とからなっている。 電極体(3) は、ガラス基板(5) とガラス基板上に形成された透明電極(9) とこの透明電極(9) 上に形成された下地層薄膜(7) と、この下地層薄膜(7)上に 形成された配向膜(8) とからなっている。

選明電極(6)、(9)には、1TO 、SnO2 などが用いられる。

配向膜(B)は、LB膜で形成されている。

本発明におけるLB膜は、一般式(]):

で表わされる両親媒性高分子物質を、水面上に展開することによりえられる単分子膜が1層以上積層されたのち、適当な熱処理を施して形成されたものである。積層回数は1~10回程度であるのが好ましい。

なお、ここにいう熱処理とは、一般式(I)で表わされる材料に環化反応を起こさせるためのもので、配向膜形成ののち液晶素子組立工程でかかる温度以上で、配向膜材料が分解する温度以下の温度による無処理であり、具体的には150~450 で、好ましくは150~250 での温度による無処理である。

このようにして形成されたLB膜は、従来の物理的もしくは物理化学的な処理をガラス基板に施して形成された処理層(配向膜)と同程度に、液晶の配向を制御する能力を有している。

本明細書でいうLB膜とは、水面上に形成された単分子膜が任意の基板上に積層されたものであり、単分子膜を積層する手法として、垂直设 液法(LB法)、水平付着法、回転円筒法などが

あげられる。このうち、積層時に単分子膜の流 動配向を生じさせる垂直浸漬法が、とくに好ま しい。

一般式(I):

で表わされる緻返し単位を有する両親媒性高分子物質とは、水面上に展開することにより単分子膜とすることができ、これを前記少なくとも電極を形成した基板上に単分子膜として一層以上、好ましくは1~10層程度積層することができ、そして積層したものを熱処理して一般式(I):

$$\begin{array}{c|c}
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0$$

で表わされる緑返し単位を有するポリイミドにすることができるものであり、その数平均分子量は、2000~300000、好ましくは2000~30000である。

数平均分子量が、2000~300000の範囲をはずれると、LB膜を作製したときの強度が低すぎたり、粘度が高すぎてLB膜の作製がうまくいかないといった問題を生じる。

などがあげられる。

本明細書にいうベンゼノイド不飽和とは、炭素環式化合物の構造に関してキノイド構造と対比して用いられる術語で、普通の芳香族化合物に含まれる炭素環と同じ形の構造をいう。

pーキノイド構造

ベンゼノイド不飽和

され誘導体となった基であってもよい。しかし、RIが少なくとも6個の炭素原子を有するベンゼノイド不飽和によって特徴づけられた基であるのが、耐熱性、耐薬品性や機械的特性などの点から好ましい。

前記のごときRIの具体例としては、たとえば、

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_2$$

$$n = 1 \sim 3$$

$$CF_2$$

$$(n = 1 \sim 3)$$

R¹の4個の結合手、すなわち一般式(I)で表わされる機返し単位において

が結合する手の位置には限定はないが、4個の結合手の各2個づつが R1を構成する隣接する2個の炭素原子に存在するばあいには、両性ポリイミド前駆体を用いて形成した膜などをポリイミド化する際に5員環を形成しやすくイミド化しやすいため好ましい。

一般式([])におけるR2は、少なくとも2個のの炭素であってもよくの話であってあかってもよく、新脂肪族の基であったが炭素であったが炭素を含むしたが炭素数1~30の脂肪族の基とが結合した基、それらの基がいのほの、カリムの原子、ニトロ基、アミノ基、シアノ基、アミノ基、アニアミスを

トキシ基、アセトキシ基などの 1 価の基で、あるいはこれらの 1 価の基が、 -0- 、 -C00- 、
-NIICO-、 -C0-、 -S- 、 -CSS- 、 -NHCS-、 -CS-などに結合した基で置換された基であってもよい。しかし、 R² が少なくとも 6 個の炭素原子を有するベンゼノイド不飽和によって特徴づけられた基であるばあいには、耐熱性、耐薬品性や機械的特性などの点から好ましい。

前記のごときR2の好ましい具体例としては、 たとえば

されそれらの甚の誘導体となった甚または水素 原子である。なお一般式(I)においてR³、R⁴、R⁵ およびR⁸はいずれも一般式(M):

(式中、R1、R2は前記と同じ)で表わされるポリアミック酸単位に疎水性を付与し、安定な疑縮膜をえるために導入される甚であり、R3、R4、R5、R6のうちの少なくとも1個が炭素原子数12~30、好ましくは18~22の前記の甚であることが、水面上に安定な疑縮膜が形成され、それがラングミアン・ブロジェット法(以下、LB法という)により薄膜電極を有するガラス基板上に累符されるために必要である。

前記のごとき R³、R⁴、R⁵、R⁵の水素原子以外の具体例としては、たとえば

(Rⁿ および Rⁿ はいずれも炭素原子数 1 ~ 3 0 の アルキルまたはアリール基) などがあげられる。

一般式(1)における R³、 R⁴、 R⁵ および R⁶ はいずれも炭素原子数 1 ~ 30、 好ましくは 1 ~ 22の 1 価の脂肪族の基、 1 価の環状脂肪族の基、 芳香族の甚と脂肪族の基との結合した 1 価の基、 それらの基がハロゲン原子、ニトロ基、 アミノ基、シアノ基、メトキシ基、アセトキシ基など置換

$$(CH_{2})_{1} C(CH_{2})_{1} - 1$$

$$(CH_{3})_{2} CH(CH_{2})_{1} - 3$$

$$(CH_{2})_{1} C(CH_{2})_{1} - 6$$

$$(CH_{2})_{1} - 6$$

(以上のnはいずれも12~30、好ましくは16~22)などがあげられる。ただ本発明の目的を違成するためには、CH3(CH2)n-1で表われる。なが本発明の目的を追びためには、CH3(CH2)n-1で表われるのが表われるのがした。これを追びました。ではないました。ではないまではない。これをはなどは必須ではない。といるではないのを使用するのが好ましい。

LB膜の作製方法としてはとくに限定はないが、 異額時流動配向がおこる方法が望ましく、垂直 没液法は望ましい実施態様の1つである。

この際、長鎖脂肪酸や長鎖アルコールのような公知ラングミュア・プロジェット膜材料や、本出願人が先に特開昭 63-218728 号に提案している高分子 LB膜材料を混合して使用してもよい。

また、LB膜を累積する前に、電極が形成されたガラス基板に表面処理を施すことも本発明の 望ましい実施態様である。

なお、本発明の液晶素子は、透明電極上に下 地層薄膜が形成されているほかは、特願平1-189137号の液晶素子と特に異なる点はない。

つぎに、実施例により、本発明の液晶素子を詳細に説明するが、本発明はかかる実施例のみ に限定されるものではない。

実施例1

約1㎞の段差を有するアモルファスSiTFT が

しては、エステル・イミド・アミド結合や、スルホン酸・りん酸・カルボン酸・アルデヒドに含まれるカルボニル甚、ヒドロキシル基があげられる。これらは、各々単独またはその複数が組み合わされてもよい。 さらに、 酸化シリコンなどの酸化物膜の表面なども空気中の水分などによりヒドロキシル基が存在しているばあいは観水性基のよい例である。

形成されたガラス基板と、 ITO およびブラック・マトリックスが形成されたガラス基板上に、 厚さ 2000人の 酸化シリコン膜を CVD 法により形成した。 さらに、前記 2 種のガラス基板上にピロメリット酸ジステアリルエステルの酸クロライドとパラフェニレンジアミンを反応させてえられる次式の単位を有するポリイミド前駆体 (分子量:約4.000)を、

LB法により、 5 届累積し、 200 でで 1 時間無処 理し電極体を作製した。この無処理により、 該ポリイミド前駆体は部分的に次式のような単位を有するポリイミドとなって、 LB膜は、 非常に良好な耐薬品性と耐熱性を有するようになった。

例1と同様の方法で液晶素子を完成した。 完成 した液晶素子をいったん100 でまで加熱してか ら徐々に冷却して初期配向させることにより、 均一で無欠陥かつ良好な配向状態の液晶素子が えられた。

実施例3

液晶を封止してTN型液晶素子を完成した。完成 した液晶素子をいったん100 でまで加熱してか ら徐々に冷却して初期配向させることにより、 均一で無欠陥かつ良好な配向状態の液晶素子が えられた。

実施例2

約 1 μm の 段差を有するアモルファス SITFT が 形成されたガラス基板と、 ITO およびブラック ・マトリックスが形成されたガラス基板上に、 次式の単位を有するポリエステル薄膜 (分子量: 約 100,000)を 膜厚約 2 μm で形成した。

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & c \\
 & c$$

さらに、これらのガラス基板上にLB法により、 実施例1と同一のLB膜を5層累積し、200 ℃で 1時間熱処理し電極体を作製した。ついで実施

スピンコート法により途布し、400 ℃で 1 時間 熱処理した。この熱処理により、上記高分子薄膜は、ほぼ次式に示す単位を有するポリイミド となった。

技ポリイミド薄膜の膜厚は、ITO とブラック・マトリックスが形成されたガラス基板上で 2 μmであった。また、他方のガラス茲板上の膜厚も 2 μmであった。

さらに、前記2種類のガラス基板上にピロメリット酸ジステアリルエステルの酸クロライドとジアミノアントラキノンを反応させてえられる次式の単位を育するポリイミド前駆体(分子盤:約5.000)を、

LB法により、 5 暦累積し、 200 ℃で 1 時間熱処理し電極体を作製した。この熱処理により、 該ポリイミド前駆体は部分的に次式のような単位を有するポリイミドとなって、 LB 膜は、 非常に良好な耐薬品性と耐熱性を有するようになった。

前記の2粒の電極体を用意し、これら2枚の

た。ついで、1TO 電極上に絶縁膜として、シリコン酸化物の膜を奥空蒸着法を用いて100mmの厚さに形成した。一方、無水ピロメリット酸とパラフェニレンジアミンを反応させてえられる次式の単位を有するポリイミド前駆体(分子量:約50.000)のN.N-ジメチルフォルムアミド溶液を、

前記のITO を蒸着したガラス基板上にスピンコート法により塗布し、400 ℃で1時間熱処理した。この熱処理により、前記高分子薄膜は、次式に示す単位を有するポリイミドとなった。

ガラス基板のLB膜形成時のガラス基板の引上げ 方向が互いに直角方向となるように液晶素子を 構成し、一方の電極体の透明電極層を形成した 面の緑部分にシール樹脂として、直径8㎞のプ ラスチックピーズを分散した酸無水物硬化型エ ポキシ樹脂を1辺のみ辺の中央部に5㎜長を残 して他の全周に1四幅で印刷したうえで、他方 の電極を対向させた状態で加圧し、140 ℃で3 時間加熱して硬化接着した。接着ののち、減圧 下で、前記開口部からネマテック液晶(メルク 社製、商品名 ZL12701)を注入した。注入ののち 開口部を市販の酸無水物硬化型エポキシ樹脂で 固着し、液晶を封止してTN型液晶素子を完成し た。完成した液晶素子をいったん100 ℃まで加 熱してから徐々に冷却して初期配向させること により、均一で無欠陥かつ良好な配向状態の液 晶素子がえられた。

実施例4

ガラス基板の片側に、パターンを形成したマスクを用いて1TO を200ng の厚さに真空蒸着し

抜ポリミド薄膜の膜原は、2 畑であった。

さらに、ピリメリット酸ジステアリルエステルの酸クロライドとパラフェニレンジアミンを 反応させてえられる次式の単位を有するポリイ ミド前駆体 (分子量:約4.000)を、

LB法により、3層累積し、400 ℃で1時間熱処理し砥極体を作裂した。この熱処理により、該

ポリイミド前駆体は完全に次式のような¶位を 有するポリイミドとなって、LB膜は、非常に良 好な耐薬品性と耐熱性を有するようになった。

実施例6

約1 μmの段差を有するアモルファス SiTFT が 形成されたガラス基板上と、 ITO およびブラッ ク・マトリックスが形成されたガラス基板上に、 厚さ 2000人の酸化アルミニウム膜をスパッタ法 により形成し、実施例 1 と同様にして LB膜を配 向膜にした TN形液晶セルを作製した。 本実施例 でえられた TN形液晶セルも、 ラピング処理を施 さずに、 均一で無欠陥かつ良好な液晶の配向状 態かえられた。

実施例7

約1 mの段差を有するアモルファス SITFT が 形成されたガラス基板上と、 ITO およびブラッ ク・マトリックスが形成されたガラス基板上に、 厚さ 2000人の酸化チタン膜を CVD 法により形成 し、実施例 1 と同様にして LB膜を配向膜にした TN形液晶セルを作製した。本実施例でえられた TN形液晶セルも、ラビング処理を施さずに、均 一で無欠陥かつ良好な液晶の配向状態がえられ た。

実施例5

約1点の段差を有するアモルファス SITFT が形成されたガラス基板上と、ITO およびブラック・マトリックスが形成されたガラス基板上に、厚さ2000人の窓化シリコン膜を CVD 法により形成し、実施例1と同様にして LB膜を配向膜とした TN形液晶セルを作製した。本実施例でえられたTN形液晶セルも、ラビング処理を施さずに、均一で無欠陥かつ良好な液晶の配向状態がえられた。

実施例8

約1 mの段差を有するアモルファス SITFT が形成されたガラス基板上と、 ITO およびブラック・マトリックスが形成されたガラス基板上に、厚さ 2000人の酸化タンタルをスパッタ法により形成し、実施例1と同様にして LB膜を配向膜にした TN形液晶セルを作製した。本実施例でえられた TN形液晶セルも、ラビング処理を施さずに、均一で無欠陥かつ良好な液晶の配向状態がえられた。

比较例

約1点の段差を有するアモルファスSiTFTが 形成されたガラス基板上と、ITOおよびブラック・マトリックスが形成されたガラス基板上に、 厚さ1000人の日本合成ゴム鍵製ポリイミド(オプトマーAL-1251)薄膜を形成し、ラピング処理を設ポリイミド薄膜に施したものを用いてTN形液品セルを作製した。

えられた実施例1~8、および比較例により えられたTN型液晶素子について、スタティック 駆動でコントラストを測定した。結果を第1表 に示す。

第 1 表

実施例番号	コントラスト
1	35:1
2	35: 1
3	40:1
4	40:1
5	35:1
6	35: 1
7	35: 1
8	35:1
比較例	. 40: 1

第1表より、実施例1~8の下地層薄膜を用いてLB膜の積層回数を低減したTN型液晶素子は、ラビング法を用いたTN型液晶素子(比較例)と同等の特性を有することがわかる。

(4): 液 晶

(7): 下地層薄膜

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば、電極体表面がラビング法による処理がなされていなくとも、液晶が均一でしかも欠陥のほとんどない配向性を示す液晶素子をうることができる。

また、本発明によれば、基板が数千人~数 mの の の を 有 し て い て も 、 甚 板 の 段 き 部 分 で の 配 向 不 良 の な い 液 晶 素 子 を う る こ と が で き る 。

さらに、本発明によれば、強電界性液晶素子のように 2 m程度のガラス基板間隔が必要とされるばあいであっても、絶縁不良のない液晶素子をうることができる。

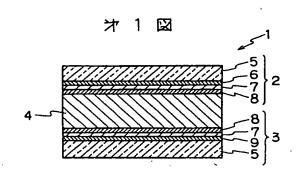
4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の液晶素子―実施例の概略断面図、第2図は従来例の液晶素子の概略断面図である。

(図面の主要符号)

(1): 液晶素子

(2)、(3): 電極体



1:液晶素子

2、3: 道極体

4:液晶

7:下地層薄膜

